圧電結晶 Ca<sub>3</sub>TaGa<sub>3</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>14</sub> 中 Ta 原子周囲 Ca 原子の可視化 Visualizing Ca toms around the Ta atom in piezoelectric crystals Ca<sub>3</sub>TaGa<sub>3</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>14</sub>

北浦 守<sup>1</sup>, Artoni Kevin R. Ang.<sup>2</sup>, 山本裕太<sup>3</sup>, 八方直久<sup>4</sup>, 木村耕治<sup>5</sup>, 林 好一<sup>5</sup>, 渡邊真太<sup>6</sup>, 大西彰正<sup>1</sup> <sup>1</sup>山形大学, <sup>2</sup>豊田工業大学, <sup>3</sup>奈良先端大学院大学, <sup>4</sup>広島市立大学, <sup>5</sup>名古屋工業大学, <sup>6</sup>東京工業大学

Mamoru KITAURA<sup>1,\*</sup>, Artoni Kevin R. ANG.<sup>2</sup>, Yuta YAMAMOTO<sup>3</sup>, Naohisa HAPPO<sup>4</sup>, Koji KIMURA<sup>5</sup>, Kouichi HAYASHI<sup>5</sup>, Shinta WATANABE<sup>6</sup>, Akimasa OHNISHI<sup>1</sup> <sup>1</sup>Yamagata Univ., <sup>2</sup>Toyota Tech. Inst., <sup>3</sup>NAIST, <sup>4</sup>Hiroshima City Univ., <sup>5</sup>Nagoya Inst. Tech., <sup>6</sup>Tokyo Inst. Tech.

## 1 <u>はじめに</u>

Ca<sub>3</sub>TaGa<sub>3</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>14</sub>(CTGS)は空間群 P321 の三方晶系に 属する圧電結晶である[1]。この物質群ではランガサ イト(La3Ga5SiO14; LGS)が最もよく知られている。 CTGS は 4 つのカチオンサイトを 4 つの異なる原子 が占める秩序型である。無秩序型の LGS と比べて圧 電特性は劣るものの、誘電特性の温度安定性などで 優れた特性を示す。CTGS を用いた圧電デバイスが 既に市販されており、燃焼センサーなどへの利用が 期待されている。

LGS 結晶の圧電性はこれまでに数多く調べられて おり、その起源を説明するモデルも提案されている [2]。LGS は、12 面体の中の A サイト、8 面体の中 の B サイト、4 面体の中の C サイトと D サイトから なる。B サイトの原子に対する A サイトの原子の変 位量が圧電性と密接に関係付けられている。CTGS の場合、Ta 原子に対する Ca の相対原子変位が圧電 性と関係すると考えられるので、その相対変位量を 調べることが CTGS の圧電性の起源を理解するため には不可欠である。

一般に格子構造を調べる場合には XRD や XAFS の測定が行われる。前者は相対原子変位を捉えるの が困難であり、後者は相対原子変位をとらえられる が遠方の原子を観測することが難しい。XRD や XAFS が抱える問題を解決できるのが蛍光 X 線ホロ グラフィー(XFH)である[3]。この方法は格子定数を 超える範囲内に存在する原子の位置と相対原子変位 を全方位にわたって観察できるユニークな構造解析 法である。本研究では、CTGS 圧電結晶において Ta 原子周りに存在する Ca 原子の位置と相対原子変位 を調べるために、Ta La蛍光 X 線をモニタして XFH の測定を 100K で行なった。

## 2 実験

実験に用いた CTGS 結晶はチョクラルスキー法で 育成された。XFH の測定は BL6C ビームラインで行 った。TaL<sub>3</sub>吸収端のエネルギーを超える単色 X 線を (001)面に照射した。試料からの Ta La 蛍光 X 線をグ ラファイト分光結晶で分光してアバランシェフォト ダイオード(APD)検出機で検知し、ディスクリミネ ーターを通してカウンターで計数した。TaLa蛍光X 線ホログラムを得るために、方位角∳を0°≤ ∮ ≤ 360° の範囲で、極角θを0°≤θ≤75°の範囲で変えて、蛍光 X線強度を計数した。入射X線の強度は試料前方の イオンチャンバーで計数し、その値で蛍光 X 線強度 を割って入射 X 線強度の変化を補正した。Ta Lα蛍 光 X 線ホログラムは入射 X 線のエネルギーを 11.0keV から 14.5keV まで 0.5keV 間隔で変えて測定 した。得られたホログラムからホログラム振動を抽 出しTa原子を中心としたクラスターの対称性を考慮 して全方位にわたって拡張した。8枚のホログラム からバートンアルゴリズムに従って原子像を再生し た。ホログラムの解析から原子像の再生にはソフト ウエアパッケージ 3D-Air-Image を利用した。

## 3 結果と考察

図1に11keV で得られた CTGS(001)面の Ta Lα蛍 光 X 線ホログラムを示す。X 線定在波に起因する 様々なパターンが見られ、Ta 原子の点対称性を反映 した3回回転対称を示す。X 線低在波線が観測され た事実は実験に用いた CTGS が結晶性の高いもので あることを示す。Ta 原子周囲の再生原子像を図2に



図 1: 11.0keV で測定した CTGS(001)面結晶の Ta La蛍光 X 線ホログラム.



図 2: z=0Å(左),2.24Å(中央),2.49Å(右)における CTGS の再生原子像。図の上と下の再生原子像はぞれぞれ実験とシミュレーションによって得られた。赤、緑、紫、青の丸はそれぞれタンタル、カルシウム、珪素、ガリウムの位置を示す。

示す。ここでは[001]軸を z 軸として z=0Å, 2.24Å, 2.49Å で切り取った面を示した。図の丸の中心が単 結晶 XRD (SC-XRD) で決定された原子位置であり、 丸の大きさに意味はない。実験とシユレーションか ら得られた再生原子像をぞれぞれ図の上と下に示し た。シミュレーションにはあらかじめ SC-XRD で決 定した結晶パラメータを用いた。原子像が丸の中に 見られ、XFHはSC-XRDで決定された原子位置を再 現する。(a)では、Ta 原子像が Ca 原子像に比べて強 い。原子像が原子番号に比例して強くなるので、こ れは妥当な結果である。Ta 原子の右側には Ca 原子 像が明瞭に観察されるが、左側には観察されない。 (d)では、左側だけでなく右側にも Ca 原子像が見ら れるが(a)に比べて弱い。(a)の右側のCa原子像の強 度は(d)の 1.11 倍であり、Ca 像強度が計算でよく再 現されている。(b)の Si 原子像は (e)のそれと比べて 弱い。(c)の Ga 原子像も(f)のそれよりも弱い。O 原 子像は見られなかった。軽元素のX線散乱係数は小 さいためである。

図2においてTa原子像とCa原子像の強度比は実験とシミュレーションで明らかに異なる。これはTa 原子像が弱められるためであり、Ta原子の大きな相 対原子変位によって引き起こされる。Ta原子の右側 のCa原子像は観測されるが、左側のCa原子像はほ とんど見られない。これの結果はTa原子とCa原子 の原子変位を別々に考えても説明できない。左側の Ca原子はTa原子と比べて大きく変位し、そのため にそのCa原子像強度が弱められる。右側のCa原子 は Ta 原子と同じ様に変位するために、Ca 原子像は 弱められずはっきりと見ることができる。

# 4 <u>まとめ</u>

圧電結晶 CTGS の Ta Lα XFH 測定を 100K で行っ た。Ta 原子周りの再生原子像の位置は SC-XRD で決 められた原子位置と一致した。一方、再生像強度は 実験とシミュレーションの間で一致していなかった。 XFH では SC-XRD で困難な二原子間での相対原子変 位を正確に再生でき、置換型圧電結晶における相対 原子変位解析にも有効であると期待される。

### 謝辞

本研究は科学研究費補助金(No. 21H05546)、生体 医歯工学共同研究拠点共同研究、物質デバイス領域 共同研究拠点基盤共同研究によってサポートされま した。CTGS 結晶は東北大学金属材料研究所吉川研 究室から提供していただきました。CTGS の SC-XRD では東北大学多元物質科学研究所の山根久典教 授にお世話になりました。厚く御礼申し上げます。

### 参考文献

- [1] S. Zhang et al., J. Appl. Phys. 105, 114107 (2018).
- [2] H. Ohsato *et al.*, Trans. Electr. Electron. Mater. **13**, 171 (2012).

[3] K. Hayashi *et al.*, J. Phys. :Condens. Matter **24**, 093201 (2012).

\* kitaura@sci.kj.yamagata-u.ac.jp